

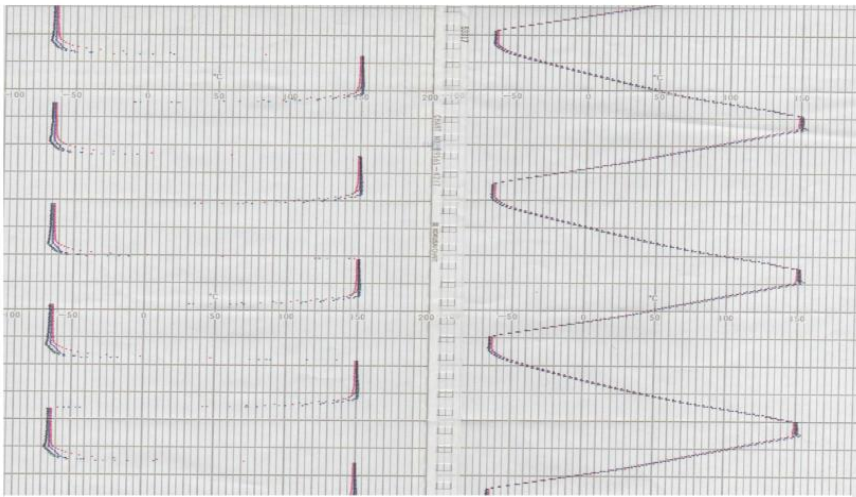
多機能試験装置

JESD A104B温度サイクル試験、MIL STD熱衝撃試験および低温、高温試験を1台でこなすマルチチャンバーをお届けします。

主な特徴

- ★鉛フリー半田接点の特性評価試験に対応しています。
- ★タッチパネルで簡単にモード（機能）の切り替えができます。
- ★5°C/分のAGREE試験、10~15/分のJEDEC試験をリニア制御で実現。
- ★同一筐体でいろいろなテストができるので機差ゼロ。互換性が高く試験品質を高めます。
- ★新設計の特殊ルーバーの採用により温度分布を大幅に改善。
- ★プリント基板、半田導体抵抗評価装置と組み合わせ可能。
- ★離れたところで操作やモニターができる無線LANシステムをオプションで用意できます。

●試験データ



MIL STD試験
-65°C/15分~150°C/15分
試料 IC 5 Kg

JESD LEVEL C試験
-65°C~150°C/10~15°C/分
試料 IC 5 Kg



JTS-815-64

●標準仕様

型式	JTS-815-100			
JESD温度サイクル				
主な試験条件	B	-55(+0, -10)~+125(+15, -0)		
	C	-65(+0, -10)~+125(+15, -0)		
	H	-55(+0, -10)~+150(+15, -0)		
	K	0(+0, -10)~+125(+15, -0)		
	M	-40(+0, -10)~+150(+15, -0)		
さらしモード (時間)	1、5、10、15分			
MID STD熱衝撃		3ゾーン		2ゾーン
高温さらし温度	150°C/15分		150°C/15分	
常温さらし温度	RT/5分			
低温さらし温度	-65°C/15分		-65°C/15分	
復帰時間	5分		5分	
試料	IC 5.0kg	IC 7.0kg	IC 5.0kg	IC 7.0kg
試験室寸法	W400×H400×D400	W400×H400×D600	W400×H400×D400	W400×H400×D600
本体外寸	W1500×H1850×D1800			